

ВЛИЯНИЕ ДЕБАЕВСКОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ  
НА СКОРОСТЬ ИОН-ИОННОЙ РЕКОМБИНАЦИИ

И. С. Лякоба, Ю. И. Смычко, Е. Д. Якубцева

УДК 535.37

Известный метод вычисления коэффициента рекомбинации ионов противоположного знака в присутствии нейтральной частицы обобщен на случай, когда существенно плазменное экранирование их электростатического взаимодействия. Приведены результаты расчетов.

В нашей работе /1/ реализован (в виде действующей программы для ЭВМ) алгоритм расчета коэффициентов  $\alpha$  трехчастичной ион-ионной рекомбинации по Натансону - Бейтсу - Фланнери - Янгу. Как отмечено в /1/, условием его применимости является

$$\max \{ \lambda_i \} \ll r_D, \quad i = 1, 2, \quad (1)$$

где  $\lambda_i$  - длины свободных пробегов катиона ( $i = 1$ ) и аниона ( $i = 2$ ) относительно столкновений с нейтральными частицами,  $r_D$  - дебаевский радиус. Предлагаемая ниже модификация метода вычисления  $\alpha$ , основанная на учете плазменного экранирования зарядов, позволяет освободиться от ограничения (1). Область применимости усовершенствованного алгоритма определяется значениями плотности заряженных частиц, при которых потенциал иона описывается в рамках первого приближения теории Дебая - Хюккеля.

Как и в /1/,

$$\alpha^{-1} \approx \alpha_T^{-1} + \alpha_L^{-1}, \quad (2)$$

где томсоновский  $\alpha_T$  и ланжевеновский  $\alpha_L$  термины аппроксимируют коэффициент рекомбинации при низкой и высокой газовой плотности соответственно. В выражении для  $\alpha_T$

$$\alpha_T \approx \pi \left[ r_1^2 w(x_1) C_1 E_1 + r_2^2 w(x_2) C_2 E_2 - r_S^2 w(y_1) w(y_2) S \right] \left( \frac{8\pi}{\pi \mu_{12}} \right)^{1/2} \quad (3)$$

меняется, по сравнению с /1/, аналитический вид параметров  $r_1$ ,  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $E_1$ . Вместо характеристических расстояний  $\lambda_1$ , на которых считалась утраченной корреляция во взаимном движении реагирующих ионов, в новом варианте вводятся

$$r_1 = (\lambda_1^{-1} + r_D^{-1})^{-1}. \quad (4)$$

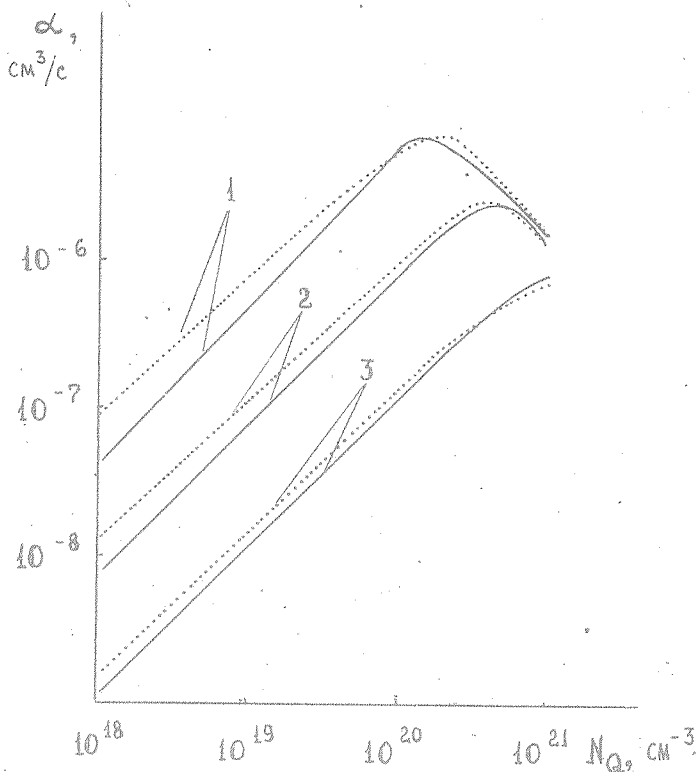
При этом радиусы  $r_1$  захвата противоположноим иона сорта  $i$  определяются из решения трансцендентных уравнений

$$\frac{3}{2} \frac{T}{e^2 \delta_i} = \frac{\exp(-r/r_D)}{r} \Bigg|_{r_1}^{r_1 + \rho_1}. \quad (5)$$

Здесь  $e$  - элементарный заряд, множитель  $\delta_i = F_i / (1 - F_i)$  характеризует изменение относительной кинетической энергии ионов после столкновения с третьей частицей,  $F_i = \left[ 2M_1 M_2 M_3 (M_1 + M_2 + M_3) / (M_1 + M_2)^2 (M_3 + M_1)^2 \right]$ ,  $M_i$  - массы ионов и нейтральной ( $i = 3$ ) частицы,  $\mu_{12} = M_1 M_2 / (M_1 + M_2)$ ,  $T$  - температура в энергетических единицах, единая для всех тяжелых частиц. Аргументами томсоновской функции вероятности  $w(z)$  являются  $x_1 = r_1 / \lambda_1$  и  $y_1 = r_S / \lambda_1$ ,  $r_S = \min\{r_1, r_2\}$ . Поправки  $E_1$  приобретают вид  $E_1 = \exp(3r_1 / 2\rho_1 \delta_i)$ ,  $S = \min\{C_1 E_1, C_2 E_2\}$ , коэффициенты  $C_i$  сохраняют прежние (см. /1/) значения:  $C_1 = 1 + (3/2)\delta_1$ . В пределе высокой плотности замена кулоновского потенциала дебаевским приводит к соотношению:

$$\alpha_L \approx 4\pi e^2 \left[ \frac{K_1}{1 - E_1^{-1}} \left( 1 + \frac{r_1}{r_D} \right) \exp\left(-\frac{r_1}{r_D}\right) + \frac{K_2}{1 - E_2^{-1}} \left( 1 + \frac{r_2}{r_D} \right) \exp\left(-\frac{r_2}{r_D}\right) \right], \quad (6)$$

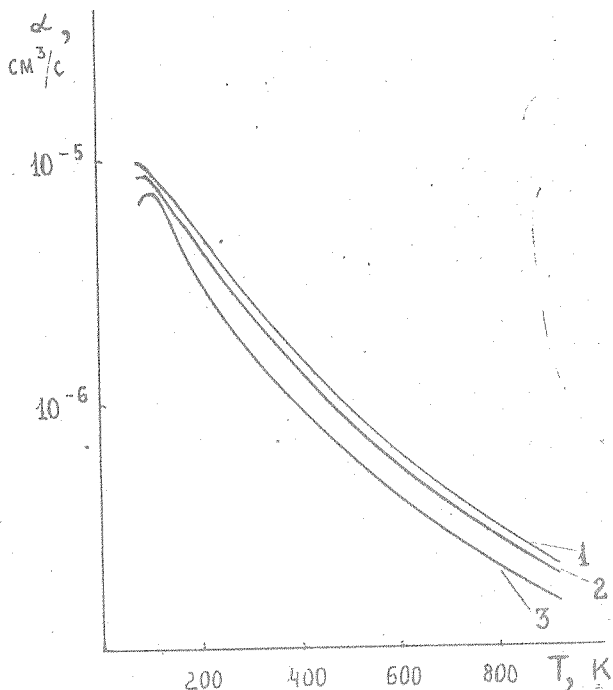
где  $K_1$  и  $K_2$  - подвижности ионов.



Р и с. 1. Коэффициент рекомбинации в системе  $Kr^+ + F^- + Q$ , где  $Q$  - эффективный буферный газ со свойствами смеси 95% гелия и 5% криптона, как функция плотности  $N_Q$  без экранирования (.....) и с экранированием (—) при  $T = 150$  К (1), 300 К (2), 600 К (3). Плотности ионов  $N_{Kr^+} = N_{F^-} = 3 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$

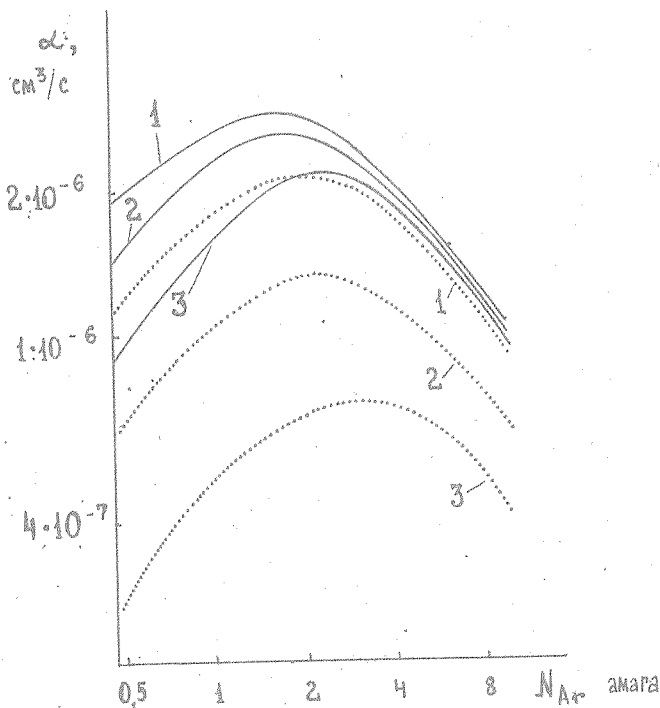
Рис. 1 и 2 на примере систем  $Kr^+ + F^- + (95\% \text{ He} + 5\% \text{ Kr})$  и  $He^+ + F^- + \text{Ne}$  иллюстрируют различные результаты расчета коэффициентов рекомбинации с учетом и без учета коллективного взаимодействия зарядов. Как и ожидалось, наибольшее расхождение зна-

чений  $\alpha$ , найденных указанными способами, достигается в области плотностей среды.



Р и с. 2. Температурная зависимость  $\alpha$  при разной плотности ионов  $\text{Xe}^+$  и  $\text{F}^-$ : 1 -  $N_{\text{Xe}^+}, N_{\text{F}^-} \rightarrow 0$ , 2 -  $N_{\text{Xe}^+} = N_{\text{F}^-} = 10^{14} \text{ см}^{-3}$ , 3 -  $N_{\text{Xe}^+} = N_{\text{F}^-} = 10^{15} \text{ см}^{-3}$ . Плотность неона  $N_{\text{Ne}} = 2 \text{ атома} = 2 \cdot 2,68 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$

Прецедент учета дебаевского экранирования при вычислении  $\alpha$  имеется в работе /2/. Расчетные формулы и процедуры, используемые в /2/ и в данной работе (следуя /1/), не идентичны. В алгоритме /2/ вероятность  $w$  образования связанной пары после столкновения одного из ионов с нейтральной частицей находится методом Монте-Карло, что, с одной стороны, могло бы дать более



Р и с. 3. Сравнение с результатами Моргана и др. для системы  $Kr^+ + F^- + Ar$  при  $T = 300 K$ : ..... - данные работы /2/, — - полученные нами значения; 1 -  $N_{Kr^+}, N_{F^-} = 0$ , 2 -  $N_{Kr^+} = N_{F^-} = 10^{14} \text{ см}^{-3}$ , 3 -  $N_{Kr^+} = N_{F^-} = 10^{15} \text{ см}^{-3}$

точные по сравнению с модельной функцией Томсона значения этой величины, но, с другой, требует больших затрат счетного времени. Кроме того, в расчетах /2/ присутствует два фактически свободных параметра - эффективный радиус захвата и критическая энергия связывания ионной пары, конкретные значения которым присваиваются без обоснования. На рис. 3 опущены зависимости от плотности буферного газа, рассчитанные с помощью алгоритма /2/ и изложенного здесь алгоритма. \*Выяснение вопроса о степени адекватности конкурирующих алгоритмов упирается в отсутствие

достоверных экспериментальных данных по обсуждаемому процессу. В такой ситуации неэкономный способ /2/ представляется менее пригодным для практического применения, например, в задачах математического моделирования плазмохимической кинетики.

Поступила в редакцию  
26 апреля 1982 г.

#### Л и т е р а т у р а

1. И. С. Лакоба, Е. Д. Сучкова, Ю. И. Сыцько, Препринт ФИАН № 8, М., 1981 г.
2. W. L. Morgan, B. L. Whitten, J. N. Bardsley, Phys. Rev. Lett., 45, 2021 (1980).